

SiC 半導体評価用試験器

◆概要

本装置は SiC 半導体や、SiC 半導体と組合わせて使用する装置を、実機に搭載させる事なく、実環境に近い評価試験が可能となる装置です。

◆特長・用途

- ・実機搭載状態に近い条件で、損失、発熱、騒音、耐久性、各種計測器を用いて波形の確認が可能となります。
- ・回生機能を有している為、大容量の試験を少ない消費電力で実現出来ます。
- ・SiC 半導体以外の、車載用リアクトル、IGBT、IPM 用の試験器へ応用も可能です。

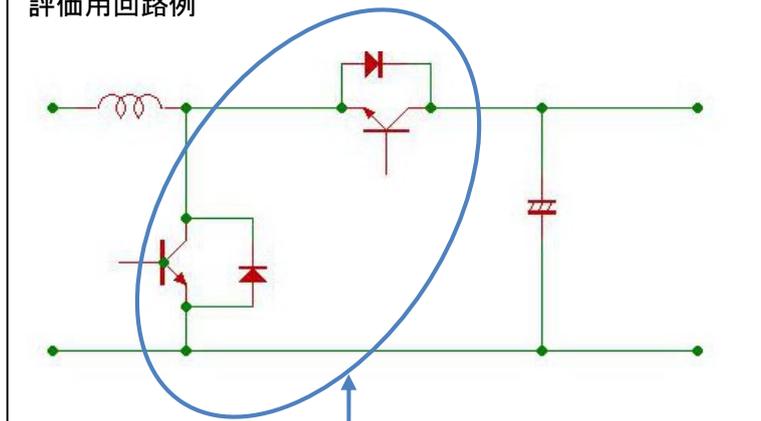
◆仕様



仕様例

出力周波数	100kHz
印加電圧	DC250V
印加電流	DC150A
入力仕様	三相 AC200V 50/60Hz

評価用回路例



※計測器は、お客様のご要望に応じて用意いたします。

※各仕様につきましては、お客様のご希望に対応したカスタマイズ設計を預かります。

評価用 SiC 半導体



東京精電株式会社

東京営業所 〒168-0081 東京都杉並区宮前4丁目28番21号
長野営業 〒386-0155 長野県上田市蒼久保1216番地
工場・技術 〒386-0155 長野県上田市蒼久保1216番地

URL : <http://www.tokyo-seiden.co.jp>

TEL. 03-3332-6666 FAX. 03-3332-6672
TEL. 0268-35-0550 (営業直通) FAX. 0268-35-2895
TEL. 0268-35-0555 (代表電話) FAX. 0268-35-2895

※本カタログの内容は2025年7月3日現在のものです。※カタログ記載の内容はお断り無く変更することがあります。